



(11) **EP 1 804 105 B8**

(12) **KORRIGIERTE EUROPÄISCHE PATENTSCHRIFT**

(15) Korrekturinformation:
Korrigierte Fassung Nr. 1 (W1 B1)
Korrekturen, siehe
Bibliographie INID code(s) 54

(51) Int Cl.:
G02B 21/22 ^(2006.01) **G02B 27/22** ^(2018.01)
H04N 13/00 ^(2018.01)

(48) Corrigendum ausgegeben am:
19.12.2018 Patentblatt 2018/51

(45) Veröffentlichungstag und Bekanntmachung des
Hinweises auf die Patenterteilung:
31.10.2018 Patentblatt 2018/44

(21) Anmeldenummer: **07002111.8**

(22) Anmeldetag: **03.02.2003**

(54) **Stereo-Untersuchungssystem und Stereo-Bilderzeugungsvorrichtung sowie Verfahren zum Betrieb einer solchen**

Stereoscopic examination system, stereoscopic image processing apparatus and operating method

Système d'inspection stéréoscopique, appareil de traitement d'images stéréoscopiques et procédé de mise en oeuvre

(84) Benannte Vertragsstaaten:
AT CH DE FR GB LI

(30) Priorität: **04.02.2002 DE 10204431**
13.01.2003 DE 10300925

(43) Veröffentlichungstag der Anmeldung:
04.07.2007 Patentblatt 2007/27

(62) Dokumentnummer(n) der früheren Anmeldung(en)
nach Art. 76 EPÜ:
03002318.8 / 1 333 305

(73) Patentinhaber: **Carl Zeiss Meditec AG**
07745 Jena (DE)

(72) Erfinder:
• **Haisch, Michael, Dr.**
73430 Aalen (DE)

• **Hauger, Christoph, Dr.**
73431 Aalen (DE)

(74) Vertreter: **Diehl & Partner GbR**
Patentanwälte
Erika-Mann-Strasse 9
80636 München (DE)

(56) Entgegenhaltungen:
JP-A- 2000 075 213 US-A- 5 067 804
US-A- 5 552 929 US-A- 5 898 518
US-B1- 6 307 636

• **PATENT ABSTRACTS OF JAPAN Bd. 2000, Nr.**
21, 3. August 2001 (2001-08-03) -& JP 2001 117049
A (OLYMPUS OPTICAL CO LTD), 27. April 2001
(2001-04-27)

EP 1 804 105 B8

Anmerkung: Innerhalb von neun Monaten nach Bekanntmachung des Hinweises auf die Erteilung des europäischen Patents im Europäischen Patentblatt kann jedermann nach Maßgabe der Ausführungsordnung beim Europäischen Patentamt gegen dieses Patent Einspruch einlegen. Der Einspruch gilt erst als eingelegt, wenn die Einspruchsgebühr entrichtet worden ist. (Art. 99(1) Europäisches Patentübereinkommen).